

STS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: STS 0766

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Foundation for Research on
Information Technologies in
Society (IT'IS)
Zeughausstrasse 43
8004 Zurich

Leiter: Dr. Tolga Goren
MS-Verantwortlicher: Prof. Dr. Niels Kuster
Telefon: +41 44 245 96 80
E-Mail: customized@itis.swiss
Internet: www.itis.swiss
Erstmals akkreditiert: 27.09.2024
Aktuelle Akkreditierung: 27.09.2024 bis 26.09.2029
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
(Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 27.09.2024

Prüflaboratorium für physikalische Prüfungen von drahtlosen Geräten, medizinischen Geräten und Implantaten sowie dielektrische Messungen

Produkte- oder Stoffgruppe, Tätigkeitsgebiet	Messprinzip ³⁾ (Merkmale, Messbereiche, Prüfungsarten)	Prüfverfahren, Bemerkungen (nationale, internationale Normen, eigene Verfahren)
MEDIZINISCHE GERÄTE UND IMPLANTATE MRI-Sicherheit von aktiven medizinischen Implantaten	 HF-induzierte Erwärmung von aktiven medizinischen Implantaten in MR-Systemen, die in der Nähe von 64 MHz oder 128 MHz arbeiten Prüfung der RF-induzierten Terminalspannung und der gestrahlten Störfestigkeit von aktiven medizinischen Implantaten in MR-Systemen, die in der Nähe von 64 MHz oder 128 MHz arbeiten	 ISO/IEC TS 10974 Absatz 8 ISO/IEC TS 10974 Absatz 15

STS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: STS 0766

Produkte- oder Stoffgruppe, Tätigkeitsgebiet	Messprinzip ³⁾ (Merkmale, Messbereiche, Prüfungsarten)	Prüfverfahren, Bemerkungen (nationale, internationale Normen, eigene Verfahren)
DIELEKTRISCHE MESSUNGEN	Dielektrische Eigenschaften fester homogener dielektrischer Proben mit einer Dielektrizitätskonstante von $1 < \epsilon < 100$ und einer Leitfähigkeit $\sigma < 10 \text{ S/m}$, bei Radiofrequenzen von 4 MHz - 67 GHz	Validiertes eigenes Verfahren basierend auf ISO/IEC TS 10974 Annex H und IEC/IEEE 62209-1528 Annex H
DRAHTLOSE GERÄTE, DIE IN DER NÄHE DES KOPFES/KÖRPERS VERWENDET WERDEN	Spezifische Absorptionsrate, induziertes E-Feld oder lokale absorbierte Leistungsdichte von Geräten, die Hochfrequenzfelder bei 4 MHz - 10 GHz aussenden Einfallende E-Feld-, H-Feld- oder Leistungsflussdichteverteilungen in den reaktiven Nah- und Fernfeldbereichen von Geräten, die Hochfrequenzfelder bei 3 kHz – 110 GHz aussenden	<p>Messung der menschlichen Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern in Phantomen nach validierten eigenen Verfahren und angepassten Verfahren basierend auf:</p> <p>IEC/IEEE 62209-1,-2,-3 IEC/IEEE 62209-1528 IEC 62232 IEC 63446</p> <p>Messung elektromagnetischer Felder nach validierten eigenen Verfahren und angepassten Verfahren basierend auf:</p> <p>IEC/IEEE 63195 IEC PAS 63184 IEEE/ANSI C63.19 IEC 62311 IEC 62232 IEC 62233 IEC/IEEE 62704 IEC PAS 63446</p>

Das Prüflaboratorium führt eine Liste mit detaillierten Angaben zu den Tätigkeiten im Geltungsbereich der Akkreditierung. Diese ist auf Anfrage beim Laboratorium erhältlich.

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung.

Abkürzung	Bedeutung
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
MRI	Magnetic Resonance Imaging (Kernspintomographie)
RF	Radio Frequency (Hochfrequenz)
TS	Technical Specification

* / * / * / * / *

1) Geltungsbereich Typ A (fix)

2) Geltungsbereich Typ B (flexibel)

3) Geltungsbereich Typ C (flexibel)

Definition der Flexibilität siehe SAS-Dokument 741